

Application/Control No. 10/607,534

Examiner VAN T. PHAM Applicant(s)/Patent under Reexamination KITANO, HISASHI

Art Unit 2627

				ISSUE	E CL	.AS	SIF	CAT	ION		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		INTERNATIONAL CLASSIFICATION										
CLASS SUBCI			LASS			CL	AIMED		NON-CLAIMED	LAIMED		
	369 12			?1	G)	13		7/00			1
	CROS	S REFERENC	CES	:					,		_	
CLASS	R BLOCK)					′			,			
									1			1 .
									1			1
			_						1			1
									1			1
1									1			1
Van T (Assi	\-	WAYNE YOUNG					Total Claims Allowed: 17					
(Legal Instruments Examiner) (Date)						Y,PA	YOUN TENT	IG (EXAM	NER	O.G. Print Fig.		
\ 9		6/10/66						4				

\boxtimes c	Claims renumbered in the same order as presented by applicant										□СРА			☐ T.D.			☐ R.1.47		
Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original		Final	Original
	1			31			61			91			121			151			181
	2			32			62			92			122		_	152			182
	_3			33			63			93			123			153			183
	4			34			64			94			124			154			184
	5			35			65			95			125			155			185
	6			36			66			96			126			156			186
	7			_37			67			97			127			157			187
	8			_38			68			98			128			158			188
	9			39			69			99			129			159			189
	10			40			70			100			130			160			190
	11			41			71			101			131			161			191
	12			42			72]		102			132			162			192
	13			43			_ 73			103			133			163			193
	14			44			74			104			134			164		-	194
	15			45			_ 75			105			135			165		_	195
	16			46			76			106			136			166			196
	17			47			77			107			137			167			197
	18			48			78			108			138			168			198
	19			49			79			109			139			169			199
	20			50			80			110			140			170			200
	21			51			81			111			141			171			201
	22	i		52			82			112			142			172			202
	23			53			83			113			143			173			203
	24	ļ		54			84			114			144			174			204
	25			55			85]		115			145			175			205
	26			56			86			116	ĺ		146			176			206
	27			57			87			117			147			177			207
	28			58			88			118			148			178			208
	29			59			89			119			149			179			209
	30			60			90			120			150			180			210